

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. július18 – július 24.									
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap		
7									
8	Mikrovákuum Kft ITO vékonyréteg vastagságvizsgálata VG	Mikroszkóp beállítás elektron oszlop kihevítése után, ESEM insert-tel VG	Berkesi Márta köpenyxenolit minták zárványainak FIB feltárása ETD, BSED, EDX vizsgálat VG, DZ	Sziráki Laura 1 db. Sn- Ni-Fe FIB, ETD/EDS 2 db Sn-Ni ETD, EDS VG	Fodor Emőke másodlagos karbonát minta ETD, BSED, EDS elemtérkép RK, VG				
9									
10									
11	Láng Győző 2 db PEDOT minta ETD vizsgálata VG	ESEM mód lehetőségeinek és a maximális felbontás vizsgálata VG, HK		Sinkó Katalin kobalt- ferrit minta szemcseméret, EDT VG, DZ					
12									
13									
14	Technoorg Kft 20 µm Cu minta felületvizsgálata VG								
15									
16						Mintakamra tisztítása VG			
17									
18	Mikroszkóp elektron oszlopának kihőkezelése (17 órától másnap reggel 8 óráig tart) VG, DZ, Török János								
19									
20									
21									

Megjegyzések

DZ
HK
RK
VG

Dankházi Zoltán
Havancsák Károly
Ratter Kitti
Varga Gábor